

УДК 537.226.33

©1994

**СУБМИЛЛИМЕТРОВАЯ РЕЛАКСАЦИЯ  
В ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫХ КЕРАМИКАХ**  
**AgNbO<sub>3</sub>–AgTaO<sub>3</sub>**

*А.А. Волков, Б.П. Горшунов, Г.А. Командин,  
И.Григас,<sup>1</sup> Г.Кужель<sup>2</sup>*

В твердых растворах AgNbO<sub>3</sub>–AgTaO<sub>3</sub> средних составов на частотах 10–20 cm<sup>-1</sup> в интервале температур 5–600 K методом диэлектрической спектроскопии зарегистрирована и исследована интенсивная дипольная релаксация, определяющая температурное поведение статической диэлектрической проницаемости, обладающая свойством вымерзать при низких температурах.

Соединения AgNbO<sub>3</sub> и AgTaO<sub>3</sub> относятся к известному семейству перовскитов, представители которых широко исследуются в связи с проблемами фазовых переходов, динамики кристаллической решетки, пиро- и сегнетоэлектричества, фоторефракции, нелинейной оптики, сверхпроводимости. При высоких температурах ( $T \geq 700$  K) AgNbO<sub>3</sub> и AgTaO<sub>3</sub> обладают кубической структурой, которая при охлаждении в результате структурных фазовых переходов последовательно изменяется на тетрагональную, орторомбическую, ромбоэдрическую и моноклинную. Ниже температур соответственно 325 и 375 K в кристаллах происходит сегнетоэлектрическое упорядочение [1].

Твердые растворы AgNbO<sub>3</sub>–AgTaO<sub>3</sub> (ANTO) привлекли к себе внимание резкой зависимостью физических свойств от соотношения концентраций ниобия и tantalа, что ярко проявляется, в частности, в поведении диэлектрической проницаемости ANTO, которая увеличивается в несколько раз при замене Ta на Nb [2]. Растворы ANTO допускают непрерывный ряд по концентрациям, обладая при этом хорошими механическими и оптическими свойствами, ухудшающимися в направлении Nb–Ta.

В серии спектроскопических работ [3,4] исследовались динамические свойства ANTO методом комбинационного рассеяния света. Одним из важных результатов было обнаружение на частотах ниже 50 cm<sup>-1</sup> сильной температурной зависимости КР-спектров, которая была описана в рамках феноменологической модели связанных резонансной (область 30–50 cm<sup>-1</sup>) и релаксационной (область 5–20 cm<sup>-1</sup>) мод.

<sup>1</sup> Вильнюсский университет, Литва.

<sup>2</sup> Университет, г. Мец, Франция.

В настоящей работе мы предприняли подробное исследование обнаруженной в [4] релаксации методом субмиллиметровых диэлектрических измерений с частичным использованием техники дальней ИК-спектроскопии.

## 1. Эксперимент

Субмиллиметровые диэлектрические измерения проводились на лабораторном ЛОВ-спектрометре<sup>3</sup> «Эпсилон» [5] в диапазоне частот 8–23 см<sup>-1</sup> и температур 5–600 К. Исследовались плоскопараллельные тонкие пластинки ANTO диаметром 10 mm с толщинами 20–100  $\mu$ , приготовленные шлифованием алмазным абразивом. Помещенные в криостат (5–300 К) или термостат (300–600 К), образцы ANTO просвечивались пучком субмиллиметрового излучения. Использовалась измерительная квазиоптическая схема в виде двухлучевого поляризационного интерферометра Рождественского–Маха–Цандера. По коэффициенту пропускания пластинок ANTO и фазовому сдвигу, вносимому ими

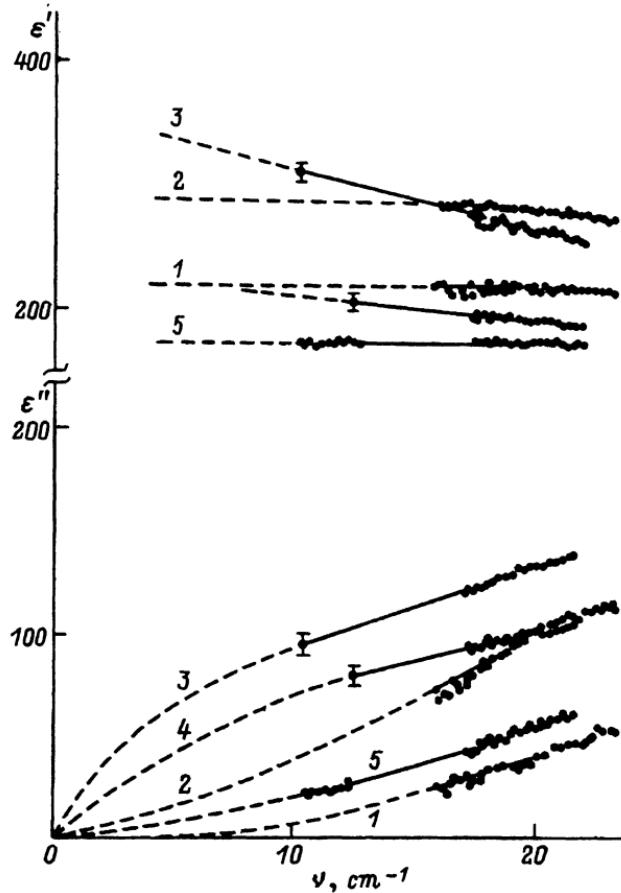


Рис. 1. Субмиллиметровые диэлектрические спектры  $\epsilon'(\nu)$  и  $\epsilon''(\nu)$  керамики  $\text{Ag}(\text{Nb}_{0.4}\text{Ta}_{0.6})\text{O}_3$  при разных температурах.

Точки, сплошные линии — эксперимент, штриховые линии — экстраполяция. Т, К: 1 — 575, 2 — 375, 3 — 250, 4 — 100, 5 — 5.

<sup>3</sup> ЛОВ — лампа обратной волны.

в интерферометр, прямым счетом по оптическим формулам Френеля определялись для фиксированной частоты действительная  $\epsilon'$  и мнимая  $\epsilon''$  части диэлектрической проницаемости. Данные записывались в автоматическом режиме в процессе сканирования частоты. Окончательно они выводились в виде спектров  $\epsilon'(\nu)$  и  $\epsilon''(\nu)$ , относящихся к фиксированным температурным точкам.

Инфракрасные измерения проводились на Фурье-спектрометре «Брукер-113» при комнатной температуре в диапазоне частот 20–1000  $\text{cm}^{-1}$ . Измерялись спектры коэффициента отражения полированных плоских поверхностей толстых ( $\geq 1 \text{ mm}$ ) буль.

На рис. 1–3 приведены данные по диэлектрическим свойствам ANTO двух (частично трех) составов: 60, 40 и 30% Nb. На рис. 1 мелкими точками представлены реальные спектры со спектрометра, измеренные в двухлучевом интерферометре. Жирными точками с усами отмечены данные, полученные в условиях прозрачности образцов ANTO, когда  $\epsilon'$  и  $\epsilon''$  измерялись без использования интерферометра по резонансам пропускания. Сплошные линии на рис. 2,3 — результат усреднения по множеству экспериментальных точек. Средние точности измерения абсолютных значений  $\epsilon'$  и  $\epsilon''$  лежат в пределах  $\pm 10\%$ . На рис. 4 показан пример спектра инфракрасного отражения.

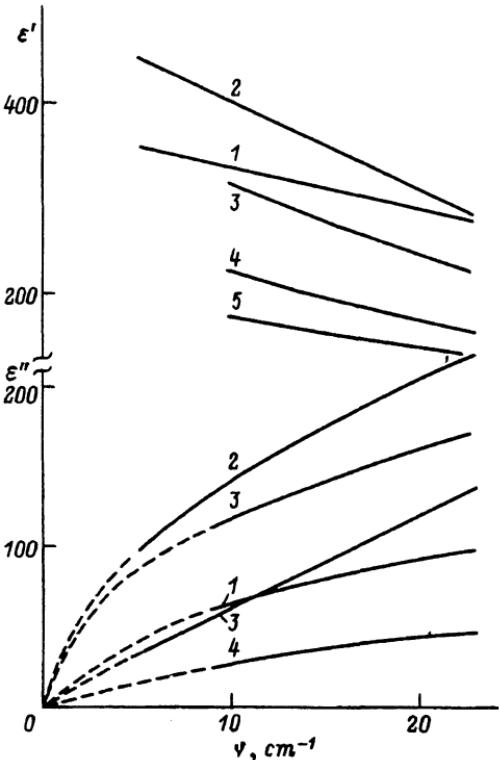


Рис. 2. Субмиллиметровые диэлектрические спектры  $\epsilon'(\nu)$  и  $\epsilon''(\nu)$  керамики  $\text{Ag}(\text{Nb}_{0.6}\text{Ta}_{0.4})\text{O}_3$  при разных температурах.

Сплошные линии — эксперимент, штриховые — экстраполяция. Т, К: 1 — 575, 2 — 375, 3 — 250, 4 — 100, 5 — 5.

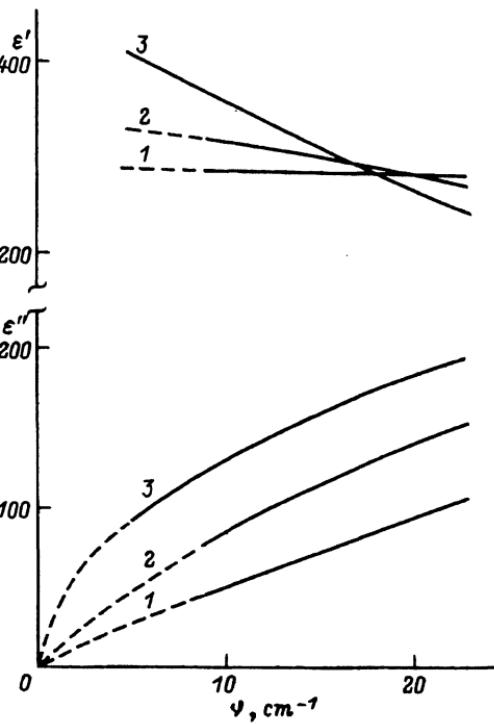


Рис. 3. Субмиллиметровые диэлектрические спектры  $\epsilon'(\nu)$  и  $\epsilon''(\nu)$  керамики  $\text{Ag}(\text{Nb}_x\text{Ta}_{1-x})\text{O}_3$  трех составов при комнатной температуре.

Сплошные линии — эксперимент, штриховые — качественная экстраполяция.  $x = 0.3$  (1), 0.4 (2), 0.6 (3).

## 2. Обсуждение

Субмиллиметровые спектры  $\epsilon'(\nu)$  и  $\epsilon''(\nu)$  на рис. 1–3 демонстрируют 1) большие диэлектрические потери в ANTO и большие значения диэлектрической проницаемости; 2) сильную немонотонную зависимость  $\epsilon'$  и  $\epsilon''$  от температуры с максимумом одновременно для  $\epsilon'$  и  $\epsilon''$  в районе 300 К для состава 40% Nb и 370 К для 60% Nb; 3) хорошо выраженную дисперсию  $\epsilon'$  и  $\epsilon''$  по частоте; 4) зависимость спектров  $\epsilon'(\nu)$  и  $\epsilon''(\nu)$  от концентраций Nb и Ta (рис. 3), заметное увеличение потерь  $\epsilon''$  и дисперсии  $\epsilon'$  по мере замещения Ta и Nb.

На качественном уровне понятно, что в спектрах  $\epsilon'(\nu)$  и  $\epsilon''(\nu)$  на рис. 1–3 проявляет себя интенсивное температурно-неустойчивое возбуждение, зависящее от состава, по-видимому, то самое, которое в [4] было определено как релаксатор. Очевидно также, что спектры  $\epsilon'(\nu)$  и  $\epsilon''(\nu)$  могут содержать в себе и вклад более высокочастотных мод.

Чтобы оценить этот вклад и выделить его из субмиллиметровых спектров, мы выполнили дисперсионный анализ инфракрасных спектров отражения  $R(\nu)$  ANTO, описав их набором четырех связанных осцилляторов (рис. 4). Параметры инфракрасных мод приведены в таблице. По этим параметрам были рассчитаны спектры  $\epsilon'(\nu)$  и  $\epsilon''(\nu)$  для широкого интервала частот, распространяющегося на субмиллиметровую область спектра, где расчетные  $\epsilon'(\nu)$  и  $\epsilon''(\nu)$  могли быть со-поставлены с измеренными (рис. 5). Как и ожидалось, вклады инфракрасных мод в  $\epsilon'$  и  $\epsilon''$  (сплошные линии) составили лишь часть измеренных субмиллиметровых значений  $\epsilon'$  и  $\epsilon''$  (точки).

Для описания спектров дополнительно к четырем осцилляторам не хватает еще одного возбуждения (условно оно показано на рис. 5 штриховой линией). Решить задачу удается с помощью простой релаксационной модели дисперсии.

$$\epsilon^* = \frac{f}{1 + i2\pi\nu/\tau},$$

где  $f$  — сила релаксатора,  $2\pi/\tau$  — характерная частота. Более надежные данные мы получили для состава 60 % Nb, в котором дисперсия  $\epsilon'(\nu)$  выражена наиболее отчетливо (рис. 6). При подгонке модели под эксперимент мы в первом приближении считали, что инфракрасный вклад  $\epsilon''$  полностью определяется самой низкочастотной из инфракрасных мод со слабо зависящими от температуры параметрами.

**Частоты  $\nu_0$ , диэлектрические вклады  $\Delta\epsilon$  и затухания  $\gamma$  инфракрасных мод ANTO-60 % Nb, рассчитанные из спектра ИК-отражения.**

$\nu_0, \text{cm}^{-1}$	$\Delta\epsilon$	$\gamma, \text{cm}^{-1}$
47.6	139.5	41.5
134.9	47.9	30.5
291.6	0.76	22.8
518.8	1.99	57.6

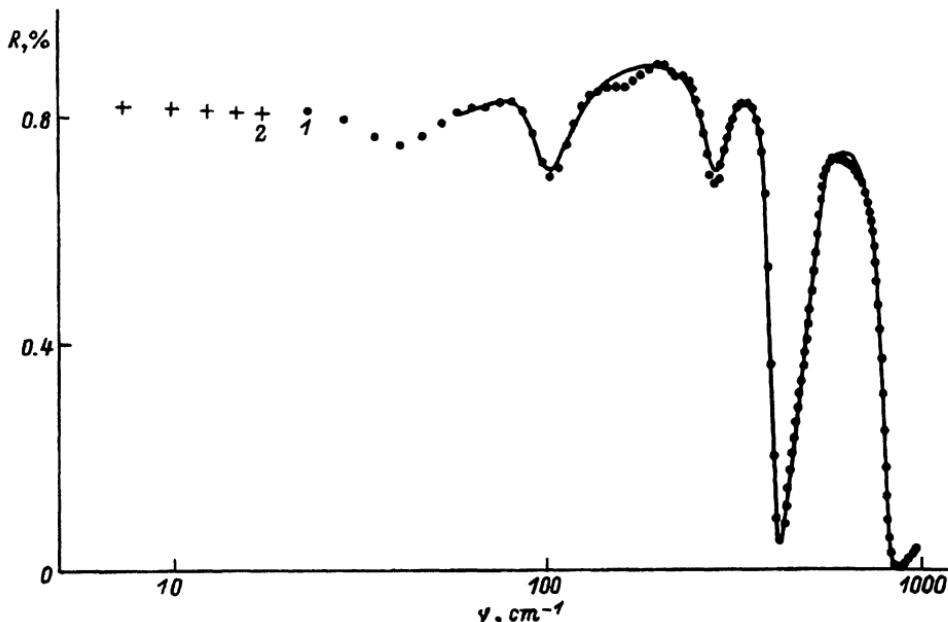


Рис. 4. Спектр коэффициента отражения керамики  $\text{Ag}(\text{Nb}_{0.6}\text{Ta}_{0.4})\text{O}_3$  при комнатной температуре, измеренный на инфракрасном спектрометре (1) и рассчитанный на основе субмиллиметровых данных по  $\epsilon'$  и  $\epsilon''$  (2).  
Сплошная линия — модель.

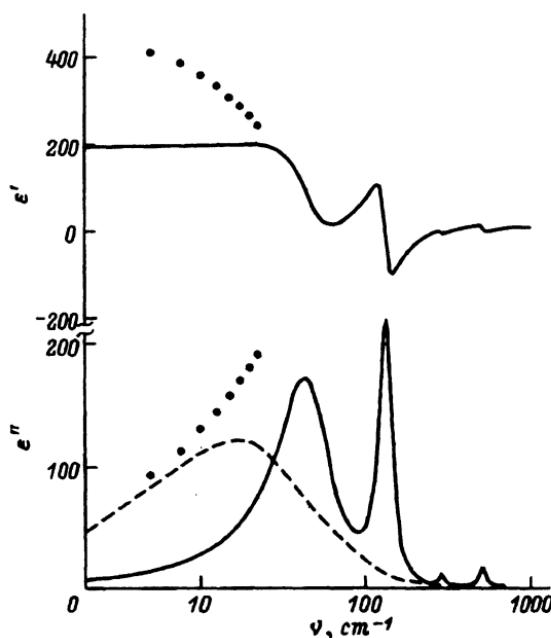


Рис. 5. Сравнение инфракрасных спектров  $\epsilon'(\nu)$  и  $\epsilon''(\nu)$  ANTO-60 (сплошные линии), рассчитанные на основе коэффициента отражения (рис. 4) и измеренных субмиллиметровых спектров  $\epsilon'(\nu)$  и  $\epsilon''(\nu)$  (точки).

Штриховой линией условно показан недостающий релаксатор.

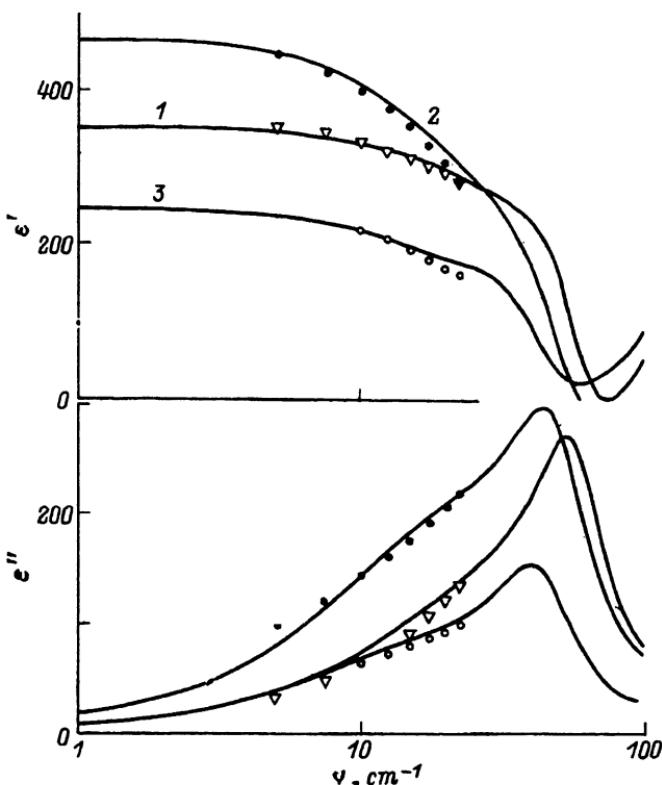


Рис. 6. Субмиллиметровая диэлектрическая дисперсия в  $\text{Ag}(\text{Nb}_{0.6}\text{Ta}_{0.4})\text{O}_3$ , рассчитанная в рамках аддитивной модели «релаксатор плюс резонатор». Точки — эксперимент.  $T, \text{K}$ : 1 — 575, 2 — 375, 3 — 100.

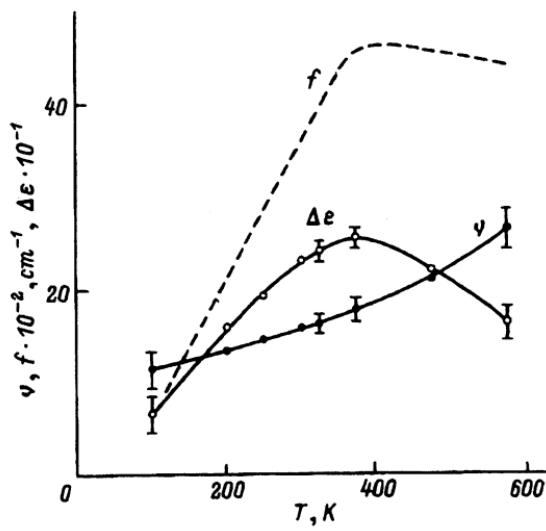


Рис. 7. Температурные зависимости параметров субмиллиметрового релаксатора ( $\nu$  — характерная частота,  $\Delta\epsilon$  — диэлектрический вклад,  $f$  — сила релаксатора ANTO-60).

Полученные в рамках такой аддитивной модели результаты для ANTO-60 представлены на рис. 7, где показано температурное поведение силы  $f$ , диэлектрического вклада  $\Delta\epsilon$  и частоты  $\nu$  релаксатора. Прежде всего бросается в глаза немонотонность зависимости  $\Delta\epsilon(T)$ , имеющей максимум в районе 300 К. Ход  $\Delta\epsilon(T)$  в точности отслеживает температурное поведение статической диэлектрической проницаемости [3]. При этом величина  $\Delta\epsilon(T)$  (в максимуме 250) совместно с вкладом инфракрасных мод ( $\Delta\epsilon \rightarrow 200$  при  $T \rightarrow 370$  К; рис.3) практически полностью определяет статику ( $\epsilon_0 \rightarrow 460$  в максимуме [3]). С точки зрения динамической теории сегнетоэлектричества, из поведения  $\Delta\epsilon(T)$  субмиллиметровый релаксатор можно рассматривать как критическую релаксацию, ответственную за размытый сегнетоэлектрический фазовый переход при  $T \rightarrow 370$  К [5].

Необычен, однако, температурный ход частоты релаксатора  $\nu(T)$ . При явно выраженным смягчении релаксатора в сторону низких температур зависимость  $\nu(T)$  в широчайшем температурном интервале остается монотонной без заметных аномалий в области пика  $\Delta\epsilon(T)$ , за исключением, может быть, изменения наклона кривой  $\nu(T)$ . Этому однозначно соответствует то, что сила релаксатора  $f = \Delta\epsilon\nu$  (штриховая линия) резко уменьшается при понижении температуры, свидетельствуя об исчезновении релаксатора из субмиллиметровой области спектра и перекачке его в другие степени свободы.

Подобный «вымерзающий» тип критической релаксации был описан ранее в приложении к дипольным стеклам на основе дигидрофосфатов аммония–рубидия ADP–RDP [6]. Там этот механизм поляризации интерпретировался как проявление кластерной динамики промежуточного состояния кристалла, предшествующего переходу в состояние дипольного стекла. Если перекачка силы релаксатора ANTO происходит на более низкие частоты, что пока остается неизвестным, то в ANTO при низких температурах можно ожидать возгорания в диэлектрических спектрах низкочастотных релаксационных полос. По аналогии со случаем ADP–RDP это могло бы свидетельствовать о существовании в ANTO стеклянной фазы.

Авторы благодарны Я. Петцелту за полезную дискуссию.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по гранту 93-02-16110.

#### Список литературы

- [1] Ланс М.Е., Гласс А.М. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы. М.:Мир, 1981. С. 736.
- [2] Kania A. // Phase Trans. 1983. V. 3. P. 131-140.
- [3] Kania A., Hafild M., Kugel G.E., Fontana M.D., Roleder K. // Ferroelectrics. 1988. V. 80. P. 141-144.
- [4] Hafild M., Kudel G.E., Kania A., Roleder K., Fontana M.D. // J. Phys. C. 1992. V. 4. P. 2333-2345.
- [5] Блинц Р., Жекш В. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. М.: Мир, 1981. 398 с.
- [6] Волков А.А., Козлов Г.В., Лебедев С.П., Синицкий А.В., Камба С., Петцелт Я. // Sov. Phys. JEPT. 1992. V. 74. P. 133-136. // ЖЭТФ. 1992. Т. 101. С. 248-255.

Институт общей физики РАН  
Москва

Поступило в Редакцию  
5 января 1994 г.